

УДК 535.372

© 1992

ПРОПУСКАНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ СВЕРХРЕШЕТКАМИ В ОБЛАСТИ ЭКСИТОННЫХ РЕЗОНАНСОВ

B. A. Кособукин

Методом матриц переноса получены точные выражения для коэффициентов пропускания, отражения и поглощения TE -поляризованного света полупроводниковой сверхрешеткой конечной толщины. При учете нелокальности диэлектрического отклика экситонов и в пренебрежении их «механическим» переносом между квантовыми ямами рассмотрены два практических важных случая: 1) движение экситона как целого квантовано ($a \gg a_B$, где a — ширина квантовой ямы, a_B — боровский радиус экситона), 2) экситоны в квантовых ямах квазидвумерны ($a \lesssim a_B$). Изучена зависимость коэффициентов пропускания, отражения и поглощения света от частоты фотонов, затухания экситонов и толщины сверхрешетки.

Электромагнитные возбуждения в периодических диэлектрических структурах, в частности в одномерных сверхрешетках (СР) [1, 2], привлекают внимание своими уникальными свойствами и многообещающими практическими приложениями. Необычные свойства поляритонов, возникающих в СР в результате взаимодействия поляризационного коллективного возбуждения и электромагнитной волны, связаны с наличием дисперсии таких возбуждений. С этой точки зрения экситонные поляритоны (ЭП), определяющие оптические свойства полупроводниковых СР вблизи края собственного поглощения, занимают особое положение, поскольку для них существенны как частотная, так и пространственная дисперсия. Свойства ЭП изучались теоретически для бесконечных СР [3–5], но остаются неясными условия применимости этих результатов к реальным СР, которые включают в себя обычно сравнительно небольшое число элементарных сверхячеек.

В данной работе развита теория распространения световых волн (экситонных поляритонов) в полупроводниковых СР конечной толщины. Методом матриц переноса [6, 7] получены точные выражения для коэффициентов пропускания, отражения и поглощения света периодической сверхрешеткой в окрестности изолированного экситонного резонанса. На основе этих выражений изучены спектральные особенности наблюдаемых величин, а также прослежен их переход к пределу полубесконечной СР. Формализм матриц переноса изложен в п. 1, а далее, в п. 2 и 3, он применен к двум моделям СР (I и II), которые соответствуют размерно-квантованным экситонам и квазидвумерным экситонам в квантовых ямах, результаты численного анализа спектров для модели II обсуждаются в п. 4. В п. 5 отмечаются возможности метода в изучении более сложных структур, таких как ограниченные СР с дефектами.

1. Метод матриц переноса для световых волн в сверхрешетках

Изучим распространение световой волны в одномерной периодической СР, которая образована N слоями AB , где A — материал квантовой ямы (КЯ) шириной

a ; B — материал, создающий барьер шириной b для движения носителей заряда между КЯ. В КЯ экситонная поляризация P_{ex} считается отличной от нуля, а фоновая диэлектрическая проницаемость равна ϵ_0 . Барьерные слои занимают области $d(n-1) + a < z < dn$, где $1 \leq n \leq N$, вдоль оси СР (ось z), имеющей период $d = a + b$. В этих слоях и в областях $z < 0$ и $z > Nd$ фоновая диэлектрическая проницаемость равна ϵ_B и $P_{ex} = 0$. Последнее условие означает, что для носителей заряда, образующих экситон, туннелирование через барьерные области B невозможно.

Рассмотрим монохроматическую (с частотой ω) электромагнитную волну TE -типа $E(t, r) = \exp[-i(\omega t - \mathbf{k}x)] E(z) \mathbf{e}_y$, где $\mathbf{k} = k_0 \sqrt{\epsilon_B} \sin \theta \mathbf{e}_\alpha$, $k_0 = \omega/c$, θ — угол падения, c — скорость света в вакууме, \mathbf{e}_α — орт α -й декартовой оси координат. Решение уравнений Максвелла в n -м безэкситонном слое B дает для электрического поля

$$E(z) = A_n \exp[ik_B(z - z_n)] + B_n \exp[-ik_B(z - z_n)], \quad (1)$$

где $k_B = \sqrt{\epsilon_B k_0^2 - \mathbf{k}^2} = k_0 \sqrt{\epsilon_B} \cos \theta$, $z_n = nd$, $n = 0$ при $z < 0$. Прохождение волны (1) через КЯ, обладающие экситонной структурой, будем описывать матрицей переноса Λ . Последняя определяется соотношением

$$\begin{pmatrix} A_{n+1} \\ B_{n+1} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix}, \quad (2)$$

которое связывает амплитуды поля (1) слева и справа от КЯ. Для изучаемых ниже моделей матрица Λ имеет вид

$$\Lambda = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} (t^2 - r^2) \exp(ik_B b) & r \exp(ik_B b) \\ -r \exp(-ik_B b) & \exp(-ik_B b) \end{pmatrix}, \quad (3)$$

где r и t — коэффициенты отражения и пропускания света одиночной КЯ, вычисленные ниже (п. 2 и 3).

Определяющую роль в теории играют собственные числа λ_\pm и векторы $W_\pm = \begin{pmatrix} u_\pm \\ v_\pm \end{pmatrix}$ матрицы Λ , которые находятся из уравнений

$$\det(\Lambda - \lambda I) = \lambda^2 - \lambda (\Lambda_{11} + \Lambda_{22}) + 1 = 0, \quad (4)$$

$$\Lambda W_\pm = \lambda_\pm W_\pm. \quad (5)$$

В (4) I — единичная матрица; Λ_{ik} — элементы матрицы (3), которая унимодулярна, т. е. $\det \Lambda = \Lambda_{11}\Lambda_{22} - \Lambda_{12}\Lambda_{21} = 1$. Учитывая условия $\lambda_+ \lambda_- = 1$ и $\lambda_+ + \lambda_- = \Lambda_{11} + \Lambda_{22}$, вытекающие из (4), и полагая $\lambda_\pm = \exp(\pm iQd)$, где $Q = Q' + iQ''$ — комплексное число, получаем для блоховских электромагнитных возбуждений (поларитонов) в бесконечной СР дисперсионное уравнение вида $\cos Qd = \text{Sp } \Lambda/2$ или

$$\cos Qd = \frac{1}{t} (t^2 - r^2 + 1) \cos(k_B b) + \frac{i}{t} (t^2 - r^2 - 1) \sin(k_B b). \quad (6)$$

Разложим вектор $\begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}$ по линейно-независимым векторам W_{\pm} задачи (5) и подействуем на него матрицей Λ^n . При учете (2) и (5) это дает

$$\begin{pmatrix} A_n \\ B_n \end{pmatrix} = \Lambda^n \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix} = \Lambda^n (c_+ W_+ + c_- W_-) = c_+ \lambda_+^n \begin{pmatrix} u_+ \\ v_+ \end{pmatrix} + c_- \lambda_-^n \begin{pmatrix} u_- \\ v_- \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Для СР, содержащей N КЯ, в уравнении (7) с $n = N$ полагаем $B_N = 0$ (нет волны, падающей на СР справа). Исключив таким образом соотношение $c_-/c_+ = -(\lambda_+^N v_+)/(\lambda_-^N v_-)$, для коэффициентов пропускания T_N и отражения R_N света получаем выражения

$$T_N = \left| \frac{A_N}{A_0} \right|^2 = \left| \frac{w_+ - w_-}{w_+ \lambda_+^N - w_- \lambda_-^N} \right|^2,$$

$$R_N = \left| \frac{B_0}{A_0} \right|^2 = \left| \frac{w_+ w_- (\lambda_+^N - \lambda_-^N)}{w_+ \lambda_+^N - w_- \lambda_-^N} \right|^2, \quad (8)$$

где $w_{\pm} = v_{\pm}/u_{\pm}$. Кроме того, определим безразмерный показатель поглощения света

$$\alpha_N = - \left(k_0 \sqrt{\varepsilon_B} dN \right)^{-1} \ln T_N. \quad (9)$$

Для полубесконечной СР ($N \rightarrow \infty$) с учетом соотношения $w_+ w_- = \exp(-2ik_B b)$ в случае (3) получаем из (8) и (9)

$$T_N \approx 1 - (w_+ / w_-)^2 \exp(-2Q'' dN) \rightarrow 0,$$

$$R_N \rightarrow |w_+|^2, \quad \alpha_N \rightarrow 2Q'' / \left(k_0 \sqrt{\varepsilon_B} \right). \quad (10)$$

Задачей дальнейшего будет вычисление матрицы Λ и величин (8), (9) для моделей I и II сверхрешетки, которые соответствуют условиям $a \gg a_B$ и $a \approx a_B$ (a_B — боровский радиус экситона) при отсутствии «механического» (без участия длинноволнового поля) переноса экситона через барьерные слои В. Модель I учитывает размерное квантование движения экситона как целого, а в модели II экситон считается квазидвумерным.

2. Размерно-квантованные экситоны в квантовых ямах

В условиях $a \gg a_B$ экситон полупроводника может быть описан изотропной диэлектрической проницаемостью

$$\epsilon_A(\omega, K) = \epsilon_0 \left[1 + \frac{\omega_{LT}}{\omega_0 + \hbar K^2/(2M) - \omega - i\Gamma} \right], \quad (11)$$

учитывающей эффекты пространственной дисперсии при конечном значении трансляционной массы экситона M . В (11) ω_0 — резонансная частота экситона,

ω_{LT} — продольно-поперечное расщепление, ϵ_0 — фоновая диэлектрическая постоянная (в общем случае $\epsilon_0 \neq \epsilon_B$).

При учете зависимости диэлектрической функции (11) от волнового вектора \mathbf{K} электрическое поле в КЯ, т. е. при $z_n^- < z < z_n^+$ с $z_n^- = d(n-1)$ и $z_n^+ = d(n-1) + a$, включает в себя добавочную волну TE -типа, что выражается формулой

$$E(z) = \sum_{l=1}^2 \{a_n^{(l)} \exp [ik_l(z - z_n^-)] + b_n^{(l)} \exp [-ik_l(z - z_n^+)]\}. \quad (12)$$

Волновые числа k_l поперечных волн с $l=1, 2$ в (12) при заданной частоте ω определяются дисперсионным уравнением ЭП

$$(x^2 + k_l^2)/k_0^2 = \epsilon_A (\omega, \sqrt{x^2 + k_l^2}). \quad (13)$$

Чтобы получить матрицу Λ , необходимо использовать максвелловские условия непрерывности на границах $z = z_n^-$ и $z = z_n^+$ касательных компонент электрического поля (1) и (12), магнитного поля $H = (-i/k_0)dE/dz$, а также дополнительные граничные условия. Последние берутся далее в форме Пекара $P_{ex} = 0$ для экситонной поляризации

$$4\pi P_{ex}(z) = \sum_{l=1}^2 (n_l^2 - \epsilon_0) \{a_n^{(l)} \exp [ik_l(z - z_n^-)] + b_n^{(l)} \exp [-ik_l(z - z_n^+)]\} \quad (14)$$

в поле (12), где $n_l^2 = \epsilon_A (\omega, \sqrt{x^2 + k_l^2})$. При этом матрица Λ выражается в форме (3) или (П.1), причем коэффициенты r и t определяются выражениями (П.2) и (П.6) из Приложения. Подстановка последних в (6) дает для блоховских ЭП бесконечной СР дисперсионное уравнение

$$\cos Qd = \frac{1}{X - Y} \{(X + Y) \cos (k_B b) - i(1 + XY) \sin (k_B b)\}, \quad (15)$$

которое при использовании (П.2) может быть преобразовано в уравнение (7) из работы [4]. Для собственных векторов матрицы (П.1) из уравнения (5) с учетом (15) находим

$$\begin{aligned} w_+ \exp (ik_B b) &= \frac{1}{XY - 1} \{(XY + 1) \cos (k_B b) + \\ &+ i[(X - Y) \sin Qd - (X + Y) \sin (k_B b)]\} = \frac{1}{w_-} \exp (-ik_B b). \end{aligned} \quad (16)$$

Использованные выше граничные условия Пекара $P_{ex} = 0$ исключают туннелирование экситонов между КЯ при любом $b > 0$, поэтому в случае $b/a \ll 1$ уравнения (15), (16) можно упростить, считая, как и в [4], что $b \rightarrow 0$. При этом (15) принимает вид $\cos Qd = (X + Y)/(X - Y)$, а в (16) $w_+ = (XY + 1)/(XY - 1)$, причем $\lambda_+ = (\sqrt{X} + \sqrt{Y}) / (\sqrt{X} - \sqrt{Y})$. Подстановка результатов (15), (16) или соответствующих предельных значений в (8)–(10) формально решает поставленную выше задачу об оптическом пропускании СР. Качественные выводы

удобно проиллюстрировать в длинноволновом пределе [4], когда из (15) следует уравнение ($\epsilon_B = \epsilon_0$)

$$(x^2 + Q^2)/k_0^2 = \tilde{\epsilon}_I(\omega, x) = \epsilon_0 \left[1 + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\omega_{LT}^{(2j+1)}}{\omega_{2j+1} + \hbar x^2/(2M) - \omega - i\Gamma} \right]. \quad (17)$$

Из (17) следует, что в спектре ЭП сверхрешетки при $x = 0$ (нормальное падение) в отличие от ЭП трехмерного полупроводника с диэлектрической функцией (11) появляются запрещенные зоны при частотах, соответствующих отрицательности правой части (17) в случае $\Gamma = 0$ [4]. Положение запрещенных зон определяется уровнями размерного квантования движения экситона как целого в КЯ

$$\omega_{2j+1} = \omega_0 + \frac{\hbar\pi^2(2j+1)^2}{2Ma^2}, \quad (18)$$

а ширина — эффективным продольно-поперечным расщеплением этих уровней

$$\omega_{LT}^{(2j+1)} = \frac{8}{\pi^2} \frac{a}{a+b} \frac{1}{(2j+1)^2} \omega_{LT}. \quad (19)$$

Возникновение запрещенных зон, связанное с невозможностью «механического» переноса экситонов между КЯ, должно сохраняться и в случае $a \sim a_B$, когда экситон двумеризуется в КЯ [4, 8], причем в пространстве между КЯ экситонной поляризацией можно пренебречь, как и в модели I. Эта ситуация рассматривается в следующих двух разделах на основе результатов работ [5, 9], относящихся к изолированному экситонному резонансу, в который переходит нижнее экситонное состояние из уравнения (17).

3. Квазидвумерные экситоны в сверхрешетке

В квантовых ямах с $a \gtrsim a_B$ представление о диэлектрической проницаемости (11) становится неприменимым. Поэтому рассмотрим микроскопическую модель экситонной поляризации [5, 8], считая, что движение электрона и дырки в КЯ размерно квантовано, а туннелирование экситонов сквозь барьерные слои по-прежнему отсутствует. Последнее означает, что в барьерных слоях существуют области, в которых огибающая волновой функции основного экситонного состояния одиночной (n -й) КЯ

$$\Psi(r_e, r_h) \sim \exp[i\mathbf{k}(m_e \boldsymbol{\rho}_e + m_h \boldsymbol{\rho}_h)/M] \varphi(\boldsymbol{\rho}_e - \boldsymbol{\rho}_h; z_e - \bar{z}_n, z_h - \bar{z}_n), \quad (20)$$

пренебрежимо мала, т. е. $|\varphi| \rightarrow 0$ при $z < d(n-1)$ и $z > dn - b$. В (20) m_e и m_h — эффективные массы электрона (e) и дырки (h), $\mathbf{r}_e = (\boldsymbol{\rho}_e, z_e)$ и $\mathbf{r}_h = (\boldsymbol{\rho}_h, z_h)$ — трехмерные радиусы-векторы их положений, причем координаты z_e и z_h в n -й КЯ отсчитываются по нормали к стенкам КЯ относительно центра КЯ $\bar{z}_n = d(n-1) + a/2$. В такой структуре макроскопическое электрическое поле может быть рассчитано из интегрального соотношения (ср. с [5]).

$$E(z) = E^0(z) + \frac{\bar{r}}{I_c^2} \int dz' e^{ik_B|z-z'|} \sum_n \Phi(z' - \bar{z}_n) \int dz'' \Phi(z'' - \bar{z}_n) E^0(z''), \quad (21)$$

причем в барьерных слоях поле (21) принимает вид (1). В (21) $E^0(z)$ — решение уравнений Максвелла в отсутствие экситонной поляризации, когда коэффициент отражения света одиночной КЯ

$$\bar{r}(\omega, \kappa) = \frac{i\Gamma_0}{\bar{\omega}_0(\kappa) - \omega - i(\Gamma + \Gamma_0)} \quad (22)$$

обращается в нуль; в (21) и далее считается, что $\varepsilon_0 = \varepsilon_B$.

С учетом симметрии $\Phi(-z) = \Phi(z)$ волновых функций $\Phi(z - \bar{z}_n) = \varphi(0; z - \bar{z}_n, z - \bar{z}_n)$ из (20) для I_c имеем

$$I_c = \int dz \Phi(z) \cos(k_B z) = \int dz \Phi(z) \exp(\pm ik_B z).$$

В выражении (22) в соответствии с результатами работы [5]

$$\Gamma_0 = \omega_{LT}(\pi a_B^3) \frac{\varepsilon_B k_0^2}{2k_B} I_c^2, \quad (23)$$

$$\bar{\omega}_0(\kappa) = \bar{\omega}_0 + \frac{\hbar\kappa^2}{2M} + \omega_{LT}(\pi a_B^3) \frac{\varepsilon_B k_0^2}{2k_B} \int \int dz dz' \sin(k_B |z - z'|) \Phi(z) \Phi(z') \quad (24)$$

суть радиационное затухание экситона и его частота с учетом размерного квантования носителей заряда (входит в частоту резонанса $\bar{\omega}_0$), пространственной дисперсии (конечной массы $M = m_e + m_h$) и радиационного сдвига, а Γ — феноменологический параметр затухания экситона в одиночной КЯ. Как для модели I, в (23), (24) ω_{LT} , a_B — продольно-поперечное расщепление и боровский радиус трехмерного экситона в объемном материале КЯ.

При условии, что $E^0(z) = A \exp(ik_B z) + B \exp(-ik_B z)$, рассматривая уравнение (21) слева и справа от одиночной КЯ, получаем выражение (2) с матрицей (3), в которой

$$r = \bar{r} \exp(ik_B a), \quad t = (1 + \bar{r}) \exp(ik_B a). \quad (25)$$

Подстановка этих выражений в (6) с учетом (22) дает дисперсионное уравнение ЭП

$$\cos Qd = \cos(k_B d) - \frac{\Gamma_0}{\bar{\omega}_0(\kappa) - \omega - i\Gamma} \sin(k_B d), \quad (26)$$

полученное в [5], а для компонент $w_{\pm} = v_{\pm}/u_{\pm}$ собственных векторов W_{\pm} из уравнения (5) находим

$$w_+ \exp(ik_B b) = \frac{1 - \cos(Q - k_B)d}{\cos Qd - \cos(k_B d)} = \frac{1}{w_-} \exp(-ik_B d). \quad (27)$$

В длинноволновом пределе ($|Q|d \ll 1$, $k_B d \ll 1$, но при любом $k_0 \sqrt{\varepsilon_B} dN$) уравнение (26) приводится к виду

$$(x^2 + Q^2)/k_0^2 = \tilde{\epsilon}_{II}(\omega, x) = \epsilon_0 \left(1 + \frac{\bar{\omega}_{LT}}{\omega_0(x) - \omega - i\Gamma} \right), \quad (28)$$

аналогичному (17). Здесь

$$\bar{\omega}_{LT} = \omega_{LT} (\pi a_B^3) \frac{1}{d} I_0^2 \quad (29)$$

— эффективное продольно-поперечное расщепление экситона в СР, а I_0 — это интеграл I_c в пределе $k_B b \rightarrow 0$. Используя длинноволновый предел $w_+ = (k_B - Q)/(k_B + Q) = 1/w$ выражения (27) и рассматривая нормальное распространение ЭП ($x = 0$), для коэффициентов (8) получаем

$$T_N = \left| \frac{4k_B Q}{\lambda_-^N (Q + k_B)^2 - \lambda_+^N (Q - k_B)^2} \right|^2,$$

$$R_N = \left| \frac{(k_B^2 - Q^2) (\lambda_+^N - \lambda_-^N)}{\lambda_-^N (Q + k_B)^2 - \lambda_+^N (Q - k_B)^2} \right|^2. \quad (30)$$

Эти выражения дают точные коэффициенты пропускания и отражения TE -поляризованного света пластиной толщины $L = dN$ с диэлектрической проницаемостью $\tilde{\epsilon}_{II}(\omega, x)$ из (28).

4. Численный анализ спектров

Для композиционных полупроводниковых сверхрешеток $d \sim 10 \div 10^3 \text{ \AA}$ [1], причем $a \sim b$. Это означает, что модель I применима к материалам с малым боровским радиусом экситона a_B , а модель II соответствует материалам с большим a_B . К последним относятся СР GaAs/AlGaAs ($a_B = 140 \text{ \AA}$), для которых мы и обсудим результаты расчета оптических спектров, относящиеся к нормальному ($x = 0$) распространению ЭП.

На рис. 1 для разных значений параметра $\gamma = \Gamma/\bar{\omega}_{LT}$ показана дисперсия ЭП (зависимость величин $q' = \operatorname{Re} Q/(k_0 \sqrt{\epsilon_B})$ и $q'' = \operatorname{Im} Q/(k_0 \sqrt{\epsilon_B})$ от $\xi = (\omega - \omega_0(0))/\bar{\omega}_{LT}$) в бесконечной СР с эффективной диэлектрической проницаемостью $\tilde{\epsilon}_{II}(\omega, 0)$ из (28) (длинноволновое приближение). Видно, что закон дисперсии ЭП даже при умеренных значениях γ существенно отличается от законов дисперсии, рассчитанных при $\gamma = 0$ по приближенной формуле (28) (с асимптотикой $\xi \rightarrow -0$ при $q' \rightarrow \infty$) и по точной формуле (26); заметим, что в последнем случае дисперсионная ветвь ЭП несколько сдвинута в область отрицательных значений ξ .

На рис. 2 представлены спектральные зависимости величин (8)–(10), а также коэффициента $1 - T_N - R_N$, характеризующего диссипацию энергии ЭП внутри СР. Из сравнения с результатами, представленными на рис. 3, 4, следует, что при $\mathcal{L} \sim 1$, где $\mathcal{L} = \sqrt{\epsilon_B} k_0 dN$ — эффективная оптическая толщина СР, спектры принципиально отличаются по форме и по интенсивности от предельных спектральных зависимостей, соответствующих $\mathcal{L} \rightarrow \infty$ ($N \rightarrow \infty$).

Спектры отражения СР R_N при разных γ (рис. 3) и разных \mathcal{L} (рис. 4) имеют максимумы в области продольно-поперечного расщепления ($0 < \xi < 1$), но

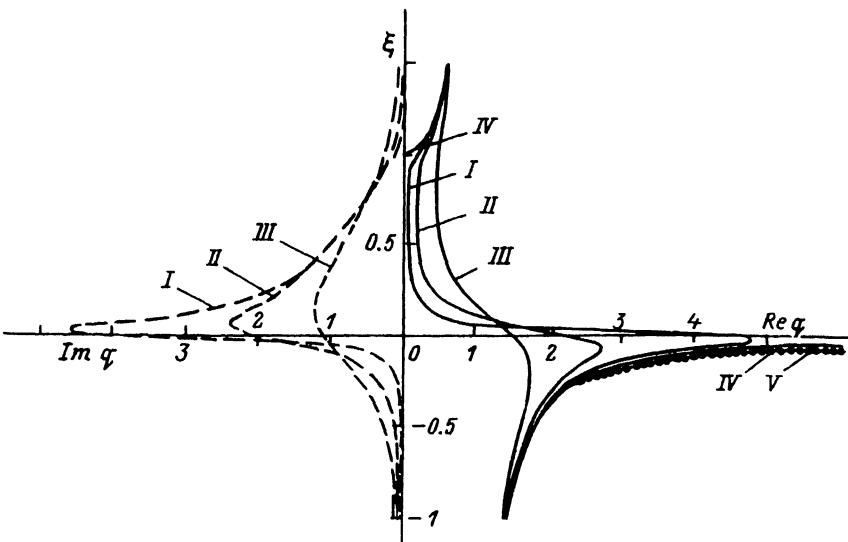


Рис. 1. Безразмерные дисперсионные зависимости $\text{Re}q' = \text{Re}Q/(k_0\sqrt{\epsilon_B})$ (сплошные кривые) и $\text{Im}q' = -\text{Im}Q/(k_0\sqrt{\epsilon_B})$ (штриховые кривые) от $\xi = (\omega - \omega_0(0))/\omega_{LT}$ для экситонных поляритонов, распространяющихся вдоль оси бесконечной сверхрешетки (модель II с $\kappa = 0$).

Кривые соответствуют следующим значениям параметра затухания $\gamma = \Gamma/\omega_{LT}$: 0.03 (I), 0.1 (II), 0.3 (III) и 0 (IV и V). Дисперсионные ветви I–IV вычислены из уравнения (28) в длинноволновом приближении, V – из точного уравнения (26).

их форма сильно зависит от \mathcal{L} . Эта зависимость отчетливо проявляется при $\xi < 0$, где возникают осцилляции, обусловленные интерференцией света внутри СР. Действительно, в этой области, согласно рис. 1, величина волнового вектора ЭП q' , а с ней и фаза интерференции $q'\mathcal{L}$, входящая в величины λ_z^N , сильно возрастают: при этом величина фазы (число осцилляций) и размах осцилляций функции $R_N(\xi)$ при $\xi < 0$ тем больше, чем меньше γ . Наибольшая близость функций $R_N(\xi)$ и $R_\infty(\xi)$ достигается в той части области $0 < \xi \ll 1$, где q'' максимально. При $\xi \sim 1$ обе величины q' и q'' сравнительно малы, поэтому функция $R_N(\xi)$ приближается к $R_\infty(\xi)$ только при $\mathcal{L} \leq 1/(2q'')$ где $1/(2q'')$ – глубина затухания ЭП.

Отметим, что условие $\sqrt{\epsilon_B} q' k_0 d < \pi$ того, что в спектре ЭП нет запрещенных зон, связанных с брэгговским рассеянием ЭП (q' не достигает границы зоны Бриллюэна СР), выполнено с запасом в длинноволновом приближении, когда $\sqrt{\epsilon_B} |q| k_0 d \ll 1$. Последнее условие может нарушаться прежде всего для экситонов с малым затуханием ($\gamma \ll 1$) вблизи резонанса ($\xi = 0$), где величины q' и q'' резко возрастают, причем $\max q' \sim \max q'' \sim 1/\sqrt{2\gamma} \gg 1$. Однако длинноволновое

приближение остается справедливым для СР с $d \ll (\sqrt{\epsilon_B} k_0 \max |q|)^{-1}$. Снизу применимость модели II ограничена величиной периода СР d^* , при которой размерность экситона в СР меняется от трех к двум из-за образования минизон носителей заряда [8]. Таким образом, результаты, полученные в длинноволновом приближении для модели II, применимы, если $d^* < d < \sqrt{2\gamma}/(k_0 \sqrt{\epsilon_B})$. Эти условия могут быть выполнены для реальных СР GaAs/AlGaAs с параметрами $\epsilon_B = 12.5 = \epsilon_0$, $d^* \cong 100 \text{ \AA}$ (при $a \cong b$) [8], $1/(k_0 \sqrt{\epsilon_B}) \cong 400 \text{ \AA}$ и $\gamma \gg 0.1$. В случае $\gamma \ll 0.1$, имеющем скорее всего теоретическое значение для современных СР,

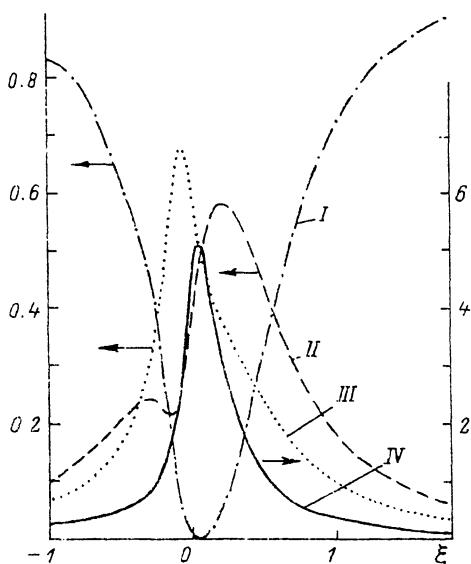


Рис. 2. Спектры пропускания T_N (I), отражения R_N (II), поглощения $1 - T_N - R_N$ (III) и показатель поглощения α_N (IV) при нормальном падении в зависимости от $\xi = (\omega - \bar{\omega}_0(0)) / \bar{\omega}_{LT}$ для сверхрешетки с оптической толщиной $\mathcal{L} = \sqrt{\varepsilon_B} k_0 d N = 1$ при $\gamma = \Gamma / \bar{\omega}_{LT} = 0.1$.

Стрелки указывают на масштабную шкалу для соответствующей величины.

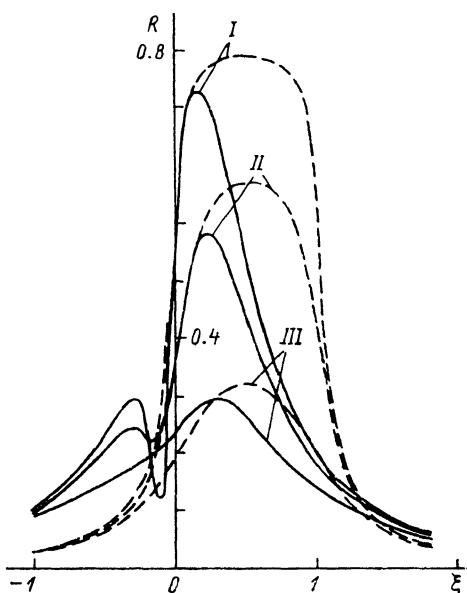


Рис. 3. Коэффициент отражения света R_N при нормальном падении от сверхрешетки с оптической толщиной $\mathcal{L} = \sqrt{\varepsilon_B} k_0 d N = 1$ (сплошные кривые) и $\mathcal{L} \rightarrow \infty$ ($N \rightarrow \infty$) (штриховые кривые) при следующих значениях параметра $\gamma = \Gamma / \bar{\omega}_{LT}$: 0.03 (I), 0.1 (II), 0.3 (III).

следует использовать точные уравнения (26), (27), анализ которых при $x = 0$ показывает, что основные черты закона дисперсии ЭП и коэффициентов (8) сохраняются.

5. Учет дефектов сверхрешетки

Метод матриц переноса удобен для изучения свойств СР с дефектами. Под дефектом полупроводниковой СР понимается ее участок, на котором или материал (A' , B'), или ширина слоя (a' , b'), или положение слоев отличается от соответствующих характеристик регулярной СР. Для примера обсудим случай дефекта, в котором слои A и B имеют измененные толщины a' и b' ; дефект включен между участками регулярной СР из N_1 сверхъячеек слева ($z < N_1 d$) и N_2 справа ($z > N_1 d + a' + b'$). Исходя из определения поля (1) в слоях B , КЯ дефектной области характеризуем матрицей переноса Λ' , имеющей собственные числа λ'_\pm и векторы W'_\pm . Используя разложение $W_\pm = \alpha_\pm W'_+ + \beta_\pm W'_-$, находим уравнение

$$\begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} = \frac{c_+}{\alpha_+ \beta_- - \alpha_- \beta_+} \left\{ \left[\lambda_+^N (\alpha_+ \beta_- \lambda'_+ - \alpha_- \beta_+ \lambda'_-) + \frac{c_-}{c_+} \lambda_+^{N_2 - N_1} \alpha_- \beta_- (\lambda'_+ - \lambda'_-) \right] W_+ + \left[\lambda_+^{N_1 - N_2} \alpha_+ \beta_+ (\lambda'_- - \lambda'_+) + \frac{c_-}{c_+} \lambda_+^{-N} (\alpha_+ \beta_- \lambda'_- - \alpha_- \beta_+ \lambda'_+) \right] W_- \right\}, \quad (31)$$

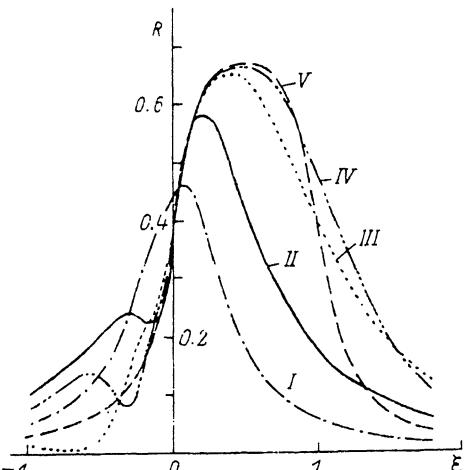


Рис. 4. То же, что и на рис. 3, при $\gamma = 0.1$ и следующих значениях оптической толщины сверхрешетки $\mathcal{L} = \sqrt{\epsilon_B} k_0 d N$: 0.5 (I), 1 (II), 2 (III), 4 (IV) и ∞ (V).

аналогичное (7) с $n = N$. Здесь $\lambda_- \lambda'_- = 1$ и $N = N_1 + N_2$. Из второго уравнения (31), полагая $B_N = 0$, найдем отношение c_- / c_+ , после чего, как и в п. 1, могут быть определены величины B_0 из (7) и A_N из (31), определяющие коэффициенты R_N и T_N в СР с дефектом.

В простейшем случае, когда дефектом является расширенная на величину Δb барьерная область N_1 -й элементарной сверхъячейки, причем $a' = 0$, $b' = \Delta b$ и $r' = 0$ в диагональ-

ной матрице Λ' вида (3), находим, что $W'_+ = \begin{pmatrix} u'_+ \\ 0 \end{pmatrix}$, $W'_- = \begin{pmatrix} 0 \\ v'_- \end{pmatrix}$ и

$$T_N = \frac{|w_- - w_+|^4 |\lambda_+|^{2N}}{|w_- (w_- \lambda'_- - w_+ \lambda'_+) + 4iw_- w_+ \lambda_+^N \times \cos [Qd(N_1 - N_2)] \sin(k_B \Delta b) - w_+ (w_- \lambda'_- - w_+ \lambda'_+) \lambda_+^{2N}|^2}. \quad (32)$$

В случае $|\lambda_+|^N = \exp(-Q''dN) \ll 1$ из (32) получаем выражение

$$T_N = \frac{|w_- - w_+|^4}{|w_-|^2 |w_- \lambda'_- - w_+ \lambda'_+|^2} \exp(-2Q''dN),$$

которое при $\lambda'_- = \lambda'_+ = 1$ ($\Delta b = 0$) переходит в T_N из (10). На частоте, удовлетворяющей условию

$$w_- \lambda'_- - w_+ \lambda'_+ = 0, \quad (33)$$

коэффициент пропускания света СР (32) принимает вид

$$T_N = \frac{\sin^2(k_B \Delta B)}{|\operatorname{ch} \beta d(N_1 - N_2)|^2},$$

а при $N_1 = N_2$ переходит в $T_N = \sin^2(k_B \Delta B)$.

Условию (33) эквивалентно уравнение

$$\operatorname{tg}(k_B \Delta B) = 2i \operatorname{sh} \beta d / (\Lambda_{11} - \Lambda_{22}),$$

которое определяет спектр (двумерную подзону) ЭП, локализованных вблизи дефекта в направлении оси СР. Длина экспоненциальной локализации электромагнитного поля вдоль оси СР равна $1/(2\operatorname{Re} \beta)$, где β определяется уравнением

$\text{ch}(\beta d) = \text{Sp} \Lambda / 2$, в которое переходят (6), (15) или (26), если частота ЭП попадает в зону запрещенных значений для блоховских состояний ЭП. Нахождение условий существования ЭП, одномерно локализованных на дефектах СР, и их спектра представляет собой важную самостоятельную задачу, на которой мы не останавливаемся (для некоторых типов дефектов СР такая задача рассматривалась в модели I [10]).

6. Заключительные замечания

Рассмотренная выше теория с формальной точки зрения во многом аналогична теории электронного переноса для одномерных моделей типа Кронига—Пенни [6, 7]. Этой аналогией определяются многообразные возможности дальнейшего обобщения теории экситонных поляритонов, в частности, на неупорядоченные полупроводниковые СР. Однако с физической точки зрения более существенные возникающие при этом принципиальные отличия от электронных задач. Так, если результаты электронной теории одномерных цепочек имеют в основном эвристическое значение из-за отсутствия соответствующих им одномерных реальных объектов [6, 7], то модель ЭП оказывается в значительной степени приближенной к реальности [8], а заложенные в ней физические эффекты — существенно богаче. Так, учту оптических резонансов в одноэлектронных моделях типа Кронига—Пенни нет аналога. Тем более это относится к эффектам пространственной дисперсии ЭП и поляризационным эффектам, которые должны проявляться при наклонном распространении ЭП по отношению к оси СР. Изучение именно этих эффектов представляется наиболее важным для дальнейшего развития теории, представленной в этой статье.

Автор признателен Е. Л. Ивченко за полезные замечания, сделанные при обсуждении результатов работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Матрица переносов для широких квантовых ям

Матрица Λ для описанной в п. 2 модели I, т. е. при $a \gg a_B$, получается из условий непрерывности на границах одиночной КЯ $z = dn$ и $z = a + dn$ касательных компонент электрического поля из (1), (12), магнитного поля $H = -(i/k_0)dE/dz$ и из дополнительных граничных условий для экситонной поляризации (14), которые берутся здесь в форме Пекара: $P_{ex} = 0$. Исключая из получающейся системы алгебраических выражений коэффициенты $a_{n+1}^{(l)}$ и $b_{n+1}^{(l)}$ для матрицы Λ в формуле (2), получаем

$$\Lambda = \frac{1}{Y - X} \begin{pmatrix} (1 - X)(1 - Y) \exp(i k_B b) & (1 - XY) \exp(i k_B b) \\ -(1 - XY) \exp(-i k_B b) & -(1 + X)(1 + Y) \exp(-i k_B b) \end{pmatrix}, \quad (\text{П.1})$$

где

$$X = \frac{i(\eta - 1)}{\eta \nu_2 \operatorname{tg}(k_2 a/2) - \nu_1 \operatorname{tg}(k_1 a/2)},$$

$$Y = \frac{i(\eta - 1)}{\nu_1 \operatorname{ctg}(k_1 a/2) - \eta \nu_2 \operatorname{ctg}(k_2 a/2)}, \quad (\text{П.2})$$

$$\eta = (n_1^2 - \varepsilon_0)/(n_2^2 - \varepsilon_0), \quad (\text{П.3})$$

а величины $n_l = \varepsilon_A(\omega, \sqrt{\chi^2 + k_l^2})$ и k_l с $l=1, 2$ определяются из дисперсионного уравнения (13) с функцией (11), $\nu_l = k_l/k_B$.

Коэффициенты отражения r и пропускания t света одиночной квантовой ямой, определяемые выражениями (здесь $n=1$)

$$E(z) = \exp(ik_B z) + r \exp(-ik_B z), \quad z < 0, \quad (\text{П.4})$$

$$E(z) = t \exp[ik_B(z-a)], \quad z > a, \quad (\text{П.5})$$

связаны с величинами (П.2) соотношениями

$$r = \frac{1}{2} \left(\frac{X-1}{X+1} + \frac{Y-1}{Y+1} \right),$$
$$t = \frac{1}{2} \left(\frac{X-1}{X+1} - \frac{Y-1}{Y+1} \right). \quad (\text{П.6})$$

При учете этих выражений в (П.1) получаем формулу (3), содержащую коэффициенты r и t .

Список литературы

- [1] Силин А. П. // УФН. 1985. Т. 147. № 3. С. 485—521.
- [2] Hunderi O. // Physica. 1989. V. A157. N 2. P. 309—322.
- [3] Agranovich V. M., Kravtsov V. E. // Solid State Commun. 1985. V. 55. N 1. P. 85—90.
- [4] Ивченко Е. Л., Кособукин В. А. // ФТП. 1988. Т. 22. № 1. С. 24—30.
- [5] Ивченко Е. Л. // ФТГ. 1991. Т. 33. № 8. С. 2388—2393.
- [6] Hori J. Spectral Properties of Disordered Chains and Lattices. Pergamon, Oxford, 1968. 229 p.
- [7] Займан Дж. Модели беспорядка. М., 1982. 591 с.
- [8] Ivchenko E. L., Kochereshko V. P., Kop'ev P. S., Kosobukin V. A., Ural'tsev I. N., Yakovlev D. R. // Solid State Commun. 1989. V. 70. N 5. P. 529—534.
- [9] Andreani L. C., Bassani F. // Physical Review. 1990. V. B41. N 1. P. 7536—7544.
- [10] Gashimzade N. F. // Physica Status Solidi. 1990. V. (b) 160. N 2. P. K113—K116.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
8 мая 1992 г.